

ゲージ

JIS B 0251 : 2008	メートルねじ用限界ゲージ	ISO 1502 : 1996(MOD)	17
JIS B 0255 : 1998	ユニファイねじ用限界ゲージ		102
JIS B 0255 : 2008	(追補1)		136
JIS B 0253 : 1985	管用テーパねじゲージ	ISO 7-2 : 1982(MOD)	137
JIS B 0254 : 2011	管用平行ねじゲージ	ISO 228-2 : 1987(MOD)	148
改 JIS B 0261 : 2020	平行ねじゲージ測定方法		199
JIS B 0262 : 1989	テーパねじゲージの検査方法		209
JIS B 3102 : 2001	ねじ用限界ゲージの形状及び寸法		220
JIS B 7420 : 1997	限界プレーンゲージ	ISO/DIS 1938-1 : 1991(MOD)	252
JIS B 3301 : 2008	テーパゲージ—モールステーパ及びメトリックテーパ		289
JIS B 0271 : 2018	ねじ測定用針	ISO 16239 : 2013(MOD)	301

長さ

JIS B 7506 : 2004	ブロックゲージ	ISO 3650 : 1998(MOD)	319
JIS B 7541 : 2001	標準尺		340
JIS B 7516 : 2005	金属製直尺		344
JIS B 7534 : 2005	金属製角度直尺		348
JIS B 7512 : 2018	鋼製巻尺		353
JIS B 7522 : 2018	繊維製巻尺		362
JIS B 7450 : 1989	デジタルスケール		368
JIS B 7545 : 2015	テストバー		375
JIS B 7503 : 2017	ダイヤルゲージ	ISO 463 : 2006(MOD)	390
JIS B 7533 : 2015	てこ式ダイヤルゲージ	ISO 9493 : 2010(MOD)	411
JIS B 7515 : 1982	シリンダゲージ		435
JIS B 7502 : 2016	マイクロメータ	ISO 3611 : 2010(MOD)	441
JIS B 7520 : 1981	指示マイクロメータ		476
JIS B 7544 : 1994	デプスマイクロメータ		482
◇ JIS B 7507 : 2016	ノギス	ISO 13385-1 : 2011(MOD)	490
JIS B 7517 : 2018	ハイトゲージ	ISO 13225 : 2012(MOD)	510
JIS B 7518 : 2018	デプスゲージ	ISO 13385-2 : 2011(MOD)	535
JIS B 7524 : 2008	すぎまゲージ		554
JIS B 7535 : 1982	流量式空気マイクロメータ		559
JIS B 7536 : 1982	電気マイクロメータ		563

JIS B 7153 : 1995	測定顕微鏡	570
JIS B 7440-1 : 2003	製品の幾何特性仕様(GPS)―座標測定機(CMM)の受入検査及び定期検査―第1部：用語	575
JIS B 7440-2 : 2013	製品の幾何特性仕様(GPS)―座標測定機(CMM)の受入検査及び定期検査―第2部：長さ測定	594
JIS B 7440-3 : 2003	製品の幾何特性仕様(GPS)―座標測定機(CMM)の受入検査及び定期検査―第3部：ロータリテーブル付き座標測定機	623
JIS B 7440-4 : 2003	製品の幾何特性仕様(GPS)―座標測定機(CMM)の受入検査及び定期検査―第4部：スキャニング測定	630
JIS B 7440-5 : 2013	製品の幾何特性仕様(GPS)―座標測定機(CMM)の受入検査及び定期検査―第5部：シングル及びマルチスタイラス測定	637
JIS B 7440-6 : 2004	製品の幾何特性仕様(GPS)―座標測定機(CMM)の受入検査及び定期検査―第6部：ソフトウェア検査	667
JIS B 7440-7 : 2015	製品の幾何特性仕様(GPS)―座標測定機(CMM)の受入検査及び定期検査―第7部：画像プローブシステム付き座標測定機	681
JIS B 7440-8 : 2015	製品の幾何特性仕様(GPS)―座標測定システム(CMS)の受入検査及び定期検査―第8部：光学式距離センサ付き座標測定機	718
JIS B 7440-9 : 2017	製品の幾何特性仕様(GPS)―座標測定システム(CMS)の受入検査及び定期検査―第9部：マルチセンサシステム付き座標測定機	782
JIS B 7440-12 : 2019	製品の幾何特性仕様(GPS)―座標測定システム(CMS)の受入検査及び定期検査―第12部：多関節アーム座標測定機(CMM)	800
JIS B 7443-3 : 2015	製品の幾何特性仕様(GPS)―座標測定機(CMM)：測定不確かさの求め方―第3部：校正された測定物又は測定標準を使用する方法	840

角 度

JIS B 7510 : 1993	精密水準器	859
JIS B 7523 : 1977	サインバー	864
JIS B 7538 : 1992	オートコロメータ	867
JIS B 7540 : 1972	Vブロック	869
JIS B 7432 : 1985	角度標準用多面鏡	873

面・形状

JIS B 7513:1992	精密定盤	877
JIS B 7514:1977	直定規	884
JIS B 7526:1995	直角定規	887
JIS B 7539:1971	円筒スコヤ	895
JIS B 7430:1977	オプチカルフラット	898
JIS B 7431:1977	オプチカルパラレル	899
JIS B 7433:1989	ニュートンゲージ	900
◇ JIS B 7184:1999	測定投影機	908
JIS B 7451:1997	真円度測定機	ISO 4291, 6318:1985(MOD) 915
JIS B 0659-1:2002	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状:輪郭曲線方式;測定標準― 第1部:標準片	ISO 5436-1:2000(MOD) 929
JIS B 0601:2013	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状:輪郭曲線方式―用語,定義及 び表面性状パラメータ	ISO 4287:1997, Amd.1:2009, Cor.1:1998, Cor.2:2005(IDT) 942
JIS B 0610:2001	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状:輪郭曲線方式―転がり円うね りの定義及び表示	960
JIS B 0631:2000	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状:輪郭曲線方式―モチーフパラ メータ	ISO 12085:1996(IDT) 964
JIS B 0633:2001	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状:輪郭曲線方式―表面性状評価 の方式及び手順	ISO 4288:1996(IDT) 976
JIS B 0634:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)―フィルタ処理―線形の輪郭曲線フィルタ: ガウシアンフィルタ	ISO 16610-21:2011(IDT) 982
JIS B 0635:2018	製品の幾何特性仕様(GPS)―フィルタ処理―線形の輪郭曲面フィルタ: ガウシアンフィルタ	ISO 16610-61:2015(IDT) 1003
JIS B 0651:2001	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状:輪郭曲線方式―触針式表面粗 さ測定機の種類	ISO 3274:1996(IDT) 1022
JIS B 0670:2002	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状:輪郭曲線方式―触針式表面粗 さ測定機の校正	ISO 12179:2000(MOD) 1034
JIS B 0671-1:2002	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状:輪郭曲線方式;プラトー構 造表面の特性評価―第1部:フィルタ処理及び測定条件	ISO 13565-1:1996(IDT) 1047
JIS B 0671-2:2002	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状:輪郭曲線方式;プラトー構 造表面の特性評価―第2部:線形表現の負荷曲線による高さの特性評 価	ISO 13565-2:1996(IDT) 1051
JIS B 0671-3:2002	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状:輪郭曲線方式;プラトー構 造表面の特性評価―第3部:正規確率紙上の負荷曲線による高さの特 性評価	ISO 13565-3:1998(IDT) 1055

JIS B 0681-2:2018	製品の幾何特性仕様(GPS)—表面性状：三次元—第2部：用語、定義及び表面性状パラメータ……………ISO 25178-2：2012(MOD)… 1068
JIS B 0681-3:2019	製品の幾何特性仕様(GPS)—表面性状：三次元—第3部：仕様オペレータ……………ISO 25178-3：2012(MOD)… 1095
JIS B 0681-6:2014	製品の幾何特性仕様(GPS)—表面性状：三次元—第6部：表面性状測定方法の分類……………ISO 25178-6：2010(IDT)… 1111
JIS B 0684-1:2019	製品の幾何特性仕様(GPS)—平面度—第1部：用語及びパラメータ……………ISO 12781-1：2011(MOD)… 1123
JIS B 0684-2:2019	製品の幾何特性仕様(GPS)—平面度—第2部：仕様オペレータ……………ISO 12781-2：2011(MOD)… 1135

基本(幾何特性)

JIS B 0021:1998	製品の幾何特性仕様(GPS)—幾何公差表示方式—形状、姿勢、位置及び振れの公差表示方式……………ISO/DIS 1101：1996(IDT)… 1149
JIS B 0022:1984	幾何公差のためのデータム……………ISO 5459：1981(MOD)… 1187
JIS B 0023:1996	製図—幾何公差表示方式—最大実体公差方式及び最小実体公差方式……………ISO 2692：1988, Amd.1：1992(IDT)… 1198
JIS B 0025:1998	製図—幾何公差表示方式—位置度公差方式……………ISO/DIS 5458：1994(IDT)… 1216
JIS B 0026:1998	製図—寸法及び公差の表示方式—非剛性部品……………ISO 10579：1993(IDT)… 1221
JIS B 0401-1:2016	製品の幾何特性仕様(GPS)—長さに関わるサイズ公差のISOコード方式—第1部：サイズ公差、サイズ差及びはめあいの基礎……………ISO 286-1：2010, Cor.1：2013(IDT)… 1224
JIS B 0401-2:2016	製品の幾何特性仕様(GPS)—長さに関わるサイズ公差のISOコード方式—第2部：穴及び軸の許容差並びに基本サイズ公差クラスの表……………ISO 286-2：2010, Cor.1：2013(IDT)… 1264
JIS B 0405:1991	普通公差—第1部：個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差……………ISO 2768-1：1989(IDT)… 1317
JIS B 0419:1991	普通公差—第2部：個々に公差の指示がない形体に対する幾何公差……………ISO 2768-2：1989(IDT)… 1320
JIS B 0420-1:2016	製品の幾何特性仕様(GPS)—寸法の公差表示方式—第1部：長さに関わるサイズ……………ISO 14405-1：2010(MOD)… 1326
新 JIS B 0420-2:2020	製品の幾何特性仕様(GPS)—寸法の公差表示方式—第2部：長さ又は角度に関わるサイズ以外の寸法……………ISO 14405-2：2018(MOD) 1362
新 JIS B 0420-3:2020	製品の幾何特性仕様(GPS)—寸法の公差表示方式—第3部：角度に関わるサイズ……………ISO 14405-3：2016(MOD) 1383
JIS B 0612:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)—円すいのテーパ比及びテーパ角度の基準値……………ISO 1119：2011(IDT)… 1403
JIS B 0615-1:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)—くさび形体—第1部：角度及び勾配の基準値……………ISO 2538-1：2014(IDT)… 1411

JIS B 0615-2:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)―くさび形体―第2部:寸法及び公差の指示方法	ISO 2538-2:2014(IDT)	1419
JIS B 0616:1996	円すいはめあい方式	ISO 5166:1982(MOD)	1428
JIS B 0621:1984	幾何偏差の定義及び表示	ISO 1101:1983(MOD)	1447
改 JIS B 0641-1:2020	製品の幾何特性仕様(GPS)―製品及び測定装置の測定による検査―第1部:仕様に対する合否判定基準	ISO 14253-1:2017(MOD)	1454
追 JIS B 0642:2010	製品の幾何特性仕様(GPS)―測定器の一般的な概念及び要求事項	ISO 14978:2006(MOD)	1483
新 JIS B 0661:2020	製品の幾何特性仕様(GPS)―マトリックスモデル	ISO 14638:2015(IDT)	1512
JIS B 0672-1:2002	製品の幾何特性仕様(GPS)―形体―第1部:一般用語及び定義	ISO 14660-1:1999(IDT)	1527
JIS B 0672-2:2002	製品の幾何特性仕様(GPS)―形体―第2部:円筒及び円すいの測得中心線, 測得中心面並びに測得形体の局部寸法	ISO 14660-2:1999(IDT)	1533
JIS B 0682-1:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)―真円度―第1部:用語及びパラメータ	ISO 12181-1:2011(MOD)	1543
JIS B 0682-2:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)―真円度―第2部:仕様オペレータ	ISO 12181-2:2011(MOD)	1556
JIS B 0683-1:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)―真直度―第1部:用語及びパラメータ	ISO 12780-1:2011(MOD)	1567
JIS B 0683-2:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)―真直度―第2部:仕様オペレータ	ISO 12780-2:2011(MOD)	1579

関 連

JIS B 0680:2007	製品の幾何特性仕様(GPS)―製品の幾何特性仕様及び検証に用いる標準温度(解説収録)	ISO 1:2002(IDT)	1593
JIS Z 8103:2019	計測用語		1602
JIS Z 8703:1983	試験場所の標準状態	ISO 554:1976, IEC 60160:1963(MOD)	1659
JIS Z 8404-1:2018	測定の不確かさ―第1部:測定の不確かさの評価における併行精度, 再現精度及び真度の推定値の利用の指針	ISO 21748:2017(IDT)	1661
JIS Z 8404-2:2008	測定の不確かさ―第2部:測定の不確かさの評価における繰返し測定及び枝分かれ実験の利用の指針	ISO/TS 21749:2005(IDT)	1698
◇ JIS Z 8405:2008	試験所間比較による技能試験のための統計的方法	ISO 13528:2005(IDT)	1727

参 考

1. 測定器の選択表	1779
------------	------

2. 機械計測関連OIML一覧	1787
3. 長さ測定機器等の規格番号対照表	1788
4. 機械計測関係団体規格一覧	1802
JISの“まえがき”の省略	1804
ISO, IECが発行する規格・出版物の著作権	1805
主なSI単位への換算率表	1807